

RM3545A 測試線選擇指南

RM3545A的測試線

為了對應各式各樣的測量對象、本指南列出七種類的測試線。
請確認測量對象的形狀和接觸的作業性能，選擇最適合的組合。

針型測試線L2100

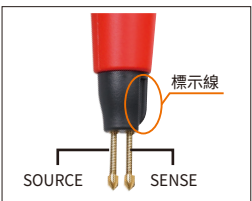
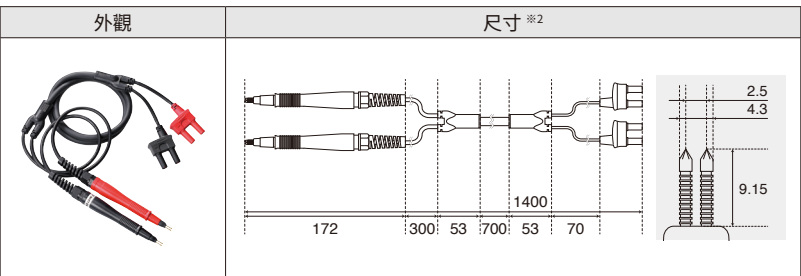
只要接觸測量對象就能進行4端子測量。
前端設有彈簧伸縮式探針可以安定的進行接觸檢查。
SOURCE Pin與SENSE Pin中間設有適度的間隔，相當適合低電阻測量。

低電阻測量用 ※1

探針間隔2.5 mm

※1：低電阻：測量電流為100 mA 以上和下個量程。除此之外的量程不保證精度。
1000 $\mu\Omega$ 量程（HIGH，LOW）、10 m Ω 量程（HIGH，LOW）、100 m Ω 量程（HIGH，LOW）、1000 m Ω 量程（僅HIGH）

單位：mm



針頭9772-90
L2100的前端交換用

測量時請注意測試線方向，並確保SOURCE側在外側。
為方便判別SENSE側的探針基座處設有標示線。

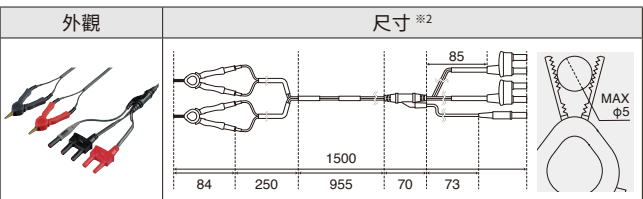
L2100沒有保護端子。測量高電阻時，請使用以下具有保護端子的測試線。

夾型測試線L2101

只要夾取測量對象就可以進行4端子測量。
作業者可以離手，在測量中需要進別的作業時非常方便。
測量電流100 mA為以上的低電阻量程的話推薦使用L2100。

可夾取的線徑0.3 mm~5 mm

單位：mm

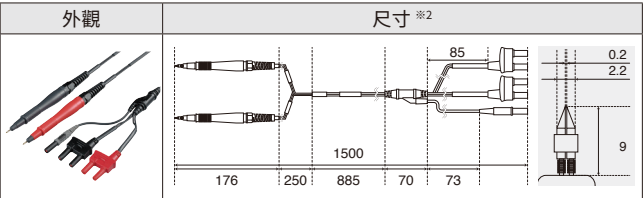


針型測試線L2103

只要接觸測量對象就能進行4端子測量。
適合接觸的範圍內的微小測量對象。

探針的間隔0.2 mm

單位：mm



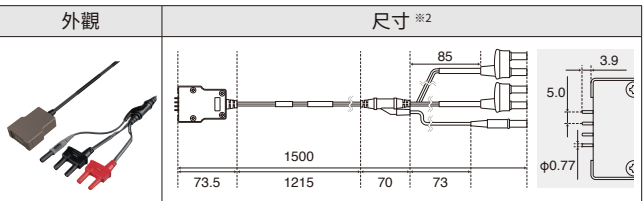
4探針探棒RM9010-01

使用專用PC軟體，將探棒壓在被測物上，就可以使用4探針法測量電阻率與導電率。便於導電性薄膜材料的評價。

探針的間隔5.0 mm

JIS K 7194標準

單位：mm



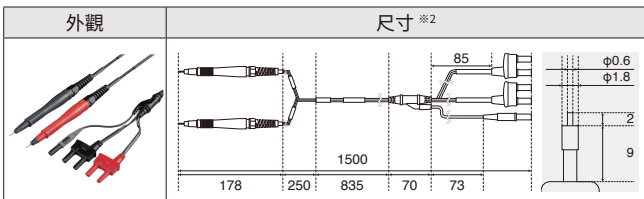
針型測試線L2102

只要接觸測量對象就能進行4端子測量。
適合無法夾取的平面的端子或可以接觸的範圍內的微小測量對象。

探針的直徑 ϕ 1.8 mm

探針的間隔0.6 mm

單位：mm

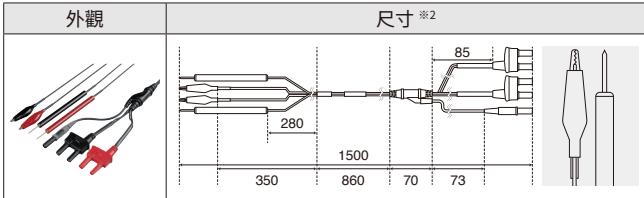


4端子測試線L2104

SOURCE端子為夾式、SENSE端子為測試探棒的4端子測試線。
最適合SOURCE端子和SENSE端子為分開的測量。

各端子獨立

單位：mm

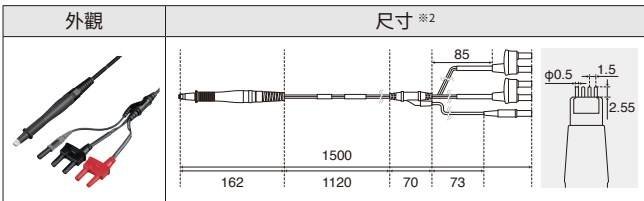


4探針探棒RM9010-02

使用專用PC軟體，將探棒壓在被測物上，就可以使用4探針法測量電阻率與導電率。便於導電性薄膜材料的評價。

探針的間隔1.5 mm

單位：mm



※2：全長以外的尺寸包含參考值。

© 2023 HIOKI E.E. CORPORATION

具體資料等以產品實際為準，如有變動，台灣日置電機股份有限公司具有最終變更權

2025年05月第一版/2505